

# ICP-OES DE DUPLA VISUALIZAÇÃO SEM ESPERA

The Measure of Confidence

## ICP-OES Agilent 5100



## O ICP-OES mais rápido do que nunca.

O ICP-OES de dupla visualização simultânea (SVDV) Agilent 5100 revoluciona a análise de ICP-OES. Com sua tecnologia exclusiva de combinador espectral dicróico (DSC), é possível realizar análise com visão radial e axial ao mesmo tempo.

### Economize tempo e dinheiro

- Execute a análise de ICP-OES mais rapidamente, usando menos gás.
- Meça todos os comprimentos de onda em apenas uma medição, para obter precisão mais alta sem atrasos.
- Comece a trabalhar rapidamente com o detector com VistaChip II sem consumo de gás que diminui o tempo de warm up.

### Desempenho sem concessões

- Meça as amostras mais complexas com uma tocha vertical.
- Obtenha estabilidade analítica a longo prazo com um sistema de RF em fase sólida.

### Simplifique sua análise

- Elimine as suposições no desenvolvimento de métodos com o software intuitivo ICP Expert e a tecnologia DSC.
- Algoritmos de software potentes simplificam o desenvolvimento de métodos, melhoram a precisão e aumentam a faixa de medição.

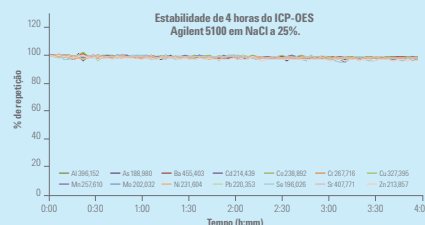
### Configurações flexíveis

O Agilent 5100 está disponível em três configurações:

- Dupla visualização simultânea.
- Dupla visualização vertical.
- Visualização radial.

## ROBUSTO E ESTÁVEL

Com uma tocha vertical e RF em fase sólida robusto em todas as configurações, o ICP-OES 5100 lida com as amostras mais complexas com facilidade.



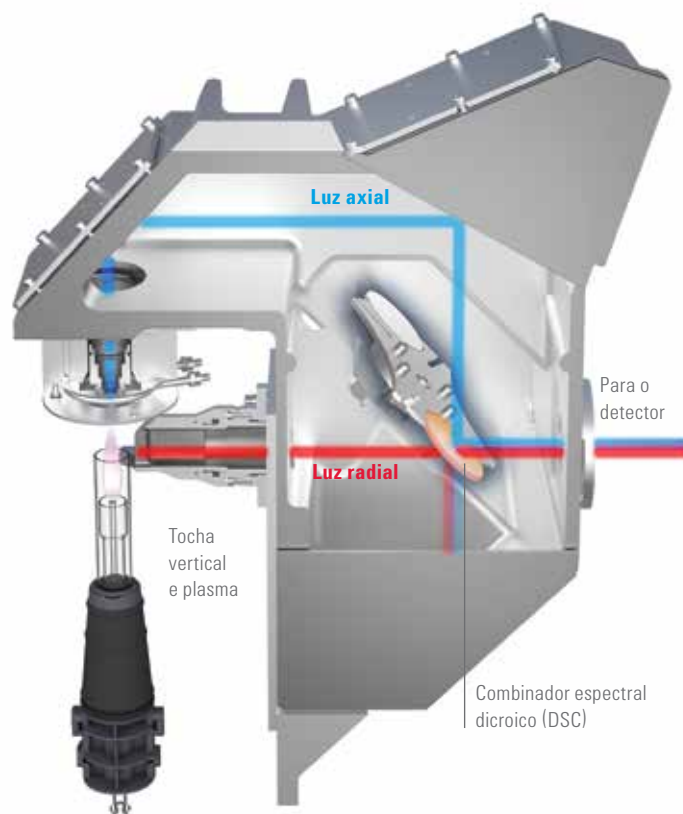
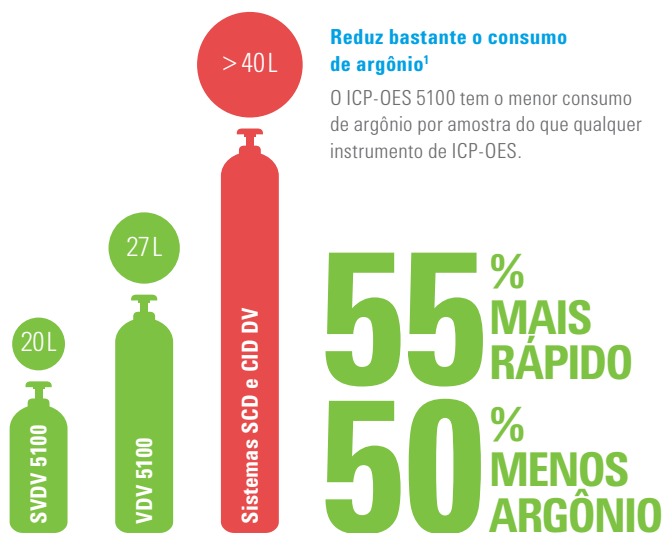
Exibição da repetição do percentual em uma gama de elementos em uma solução de NaCl a 25%. A estabilidade da repetição para todos os elementos depois de 4 horas teve RSD < 1,3%, sem padronização interna.



Agilent Technologies

## Como a dupla visualização simultânea funciona?

O ICP-OES SVDV 5100 precisa de uma única medição por amostra. O combinador espectral dicróico permite que tanto a visualização axial quanto a radial do plasma sejam capturadas em uma única leitura. Isso proporciona resultados precisos no menor tempo possível<sup>1</sup>.



### VOCÊ SABIA?

Sistemas ICP-OES de dupla visualização convencionais exigem a configuração de medições sequenciais ao selecionar quais elementos são medidos no modo axial e quais são medidos no modo radial.

Alguns sistemas também usam duas fendas para medir comprimento de onda de frequência alta e baixa em cada modo, resultando em até quatro medições sequenciais em cada amostra e tornando lenta a frequência analítica.

1. A velocidade da análise e o consumo de gás são comparados com sistemas concorrentes, com base em dados de aplicação publicados. Consulte a nota de aplicação 5991-4821EN da Agilent

Para obter mais informações:  
Entre em contato com o representante  
local da Agilent ou acesse  
[www.agilent.com/chem/5100icpoes](http://www.agilent.com/chem/5100icpoes)

Essas informações estão sujeitas a alterações  
sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2014  
Publicado em 1º de julho de 2014  
5991-4835PTBR

